

## 平成 23 年度「マテリアル電子線トモグラフィ研究部会」講演会

本研究部会では、本年度も以下の日程で講演会を開催いたします。電子線トモグラフィ法の基礎と応用はもちろんのこと、階層的構造解析研究の認識のもと、関連する他の 3 次元解析手法も取り上げておりますので、奮ってご参加くださいますようお願いいたします。

日時：平成 23 年 12 月 16 日(金)

講演会場：工学院大学 新宿キャンパス 3 階アーバンテックホール

### 参加費（テキスト代含む）

日本顕微鏡学会 会員 ¥3,000-  
非会員 ¥4,000-  
学生 無料

- \* 講演終了後には懇談の場といたしまして茶話会（無料）を予定しております。
- \* なお、企業展示も予定しております。

### プログラム

#### チュートリアル：トモグラフィのための試料作製および試料観察法

10:00 ~ 10:30 TEM 試料作製法 -ソフトマテリアルを中心に-  
西岡秀夫（日本電子）

10:30 ~ 11:00 3 次元立体構造解析のための試料作製法と観察法  
葦原雅道（FEI）

11:00 ~ 11:30 三次元構造解析用ピンポイント FIB 加工法  
佐藤高広（日立ハイテクノロジーズ）

#### トピック I：最近の研究から、定量解析、高分解能、新再構成法

13:00 ~ 13:30 極低温電子線トモグラフィによる触媒材料の定量解析  
吉田健太（JFCC），田中信夫（名古屋大学）

13:30 ~ 14:00 セラミックス界面の 3 次元原子構造解析  
柴田直哉（東京大学）

14:00 ~ 14:30 投影データ欠落と不足に影響されない新たな再構成法  
馬場則男 (工学院大学)

### 生物系特別講演

15:00 ~ 15:30 Zernike 位相差電子顕微鏡の原理と生物応用  
村田和義 (自然科学研究機構)

### トピックⅡ : FIB-SEM シリアルセクションニング

15:40 ~ 16:10 FIB-SEM デュアルビーム装置を用いた GdBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub> 超電導線材の 3次元構造解析  
加藤丈晴 (JFCC)

16:10 ~ 16:40 FIB-SEM で見る半導体の不良解析  
朝山匡一郎 (ルネサステクノロジ)

16:40 ~ 17:10 直交配置型 FIB-SEM の特徴と金属材料組織観察への応用  
原 徹 (物質・材料研究機構)

17:10 ~ 茶話会

#### 工学院大学新宿キャンパス案内図

TEL.03-3342-1211 (代)

URL <http://www.kogakuin.ac.jp/>

問合せ先 : 工学院大学・情報学部、馬場則男  
E-mail: <ed11001@ns.kogakuin.ac.jp>

